

電気・電子関係機器 (解析・測定・観察)

機器番号	機器名	メーカー / 型式	仕様	概要・用途	料金 円/時間
E200	高精度 12bit 型ミックスド・シグナル・オシロスコープ	テレダイン・レクロイ / HDO6034-MS	帯域幅、サンプリング速度：350MHz、2.5GS/s 垂直軸分解能：12ビット、 DCゲイン精度：±0.5% (フルスケール)、 ミックスド・シグナル解析：アナログ 4ch、 ロジック 16ch、シリアル (I2C、SPI、UART)・ トリガ/デコード、 パワー解析：スイッチング電源解析ソフト、 差動アンプ、 スペクトラム・アナライザ機能	各種電子部品の電源特性評価や高分解能センサの評価 LED照明評価や渦流探傷装置の渦電流周波数測定など	260
E201	2GHz帯デジタル・オシロスコープ	テレダイン・レクロイ / WaveRunner 620Zi	帯域幅、サンプリング速度：2GHz、10GS/s、 垂直軸分解能：8ビット、アクティブプローブ： ZS2500(帯域幅：2.5GHz)、差動プローブ： ZD1500(帯域幅：1.5GHz)	広帯域な電圧・電流波形の測定	260
E202	ホトマスク撮影カメラ	酒井特殊カメラ製作所 / トヨビュー45G 改造品	原図サイズ：約 1m×1m、 縮小倍率：1/1～1/30 程度、 ガラス乾板：□4 インチ	ガラス感板への縮小撮影 (微細加工用)	110
E203	走査型プローブ顕微鏡	セイコーインスツルメント(株) / SPI3800	測定モード：AFM、STM、 スキャン範囲：□20μm、□150μm、 試料：φ25mm×5mm 厚まで	電子部品などの表面微小領域の表面形状や物性の測定	1,420
E204	分光光度計 (電子材料分光特性評価装置)	(株)島津製作所 / SolidSpec-3700	測定波長範囲：240～2,600nm、 大型試料室、 可変角絶対反射測定装置 5～70°、 色彩、膜厚、日射透過・反射率計算	固体材料の光学特性 (反射率、透過率等) の計測	570
E205	ソースコード静的解析ツール	Programming Research Limited / PQAC/FL1、MCM/PC (株)エクスマーション / eXquto	C言語対応 MISRA-Cルールチェック機能、 IPA/SECコーディング作法ガイド適合度評価機能	組込みソフトウェア (C言語ソースコード) の品質の測定、評価	330
E206	微細形状観察評価装置 (レーザー顕微鏡)	(株)キーエンス / VK-9700SP	測定用光源：バイオレットレーザ 408nm、 対物レンズ倍率：5、10、20、50、150×、 電動ステージ：50mm×50mm 可動、 12インチウェハ用ステージ付属	微小立体物表面の非接触 3次元計測	1,950
E207	制御技術開発用モデルベース設計ツール	マスワークス / MATLAB/Simulink dSPACE / DS1104	リアルタイムシミュレーション機能、 Cコード自動生成機能、 システム同定機能、パラメータ最適化機能	机上/リアルタイムシミュレーションにより制御アルゴリズムの設計、検証	880
E208	スペクトラム・アナライザ U3751	(株)アドバンテスト / U3751	周波数範囲：9kHz～8GHz、 トラッキング・ジェネレータ (100kHz～3GHz) 付き	無線・高周波回路における周波数に対する信号強度の測定	150
E209	ネットワーク・アナライザ	アジレントテクノロジー(株) / E5071C	周波数範囲：300kHz～4.5GHz バイアス・テ ィー付き、ポート数：2、 ダイナミック・レンジ：>123dB、 トレース・ノイズ：<0.004dBrms、 エンハンスド・タイム・ドメイン解析機能	高周波回路における伝送路の分析・試験	580